

Micro- y Nano-Characterización de Superficies y Materiales

CURSO PRÁCTICO
3ª Edición

18, 19 y 20 Abril/2018

DIRIGIDO A EMPRESAS Y USUARIOS INDUSTRIALES

Organizan:



Colaboran:



AGENDA DEL CURSO

Miércoles, 18 de Abril

- 10.30h – 11.30h:** Apertura del Curso y bienvenida. Presentación del INA, del LMA-ELECMI y de los objetivos del curso. *Dra. Pilar Cea (Coordinadora LMA-ELECMI).*
- 11.30h – 13.00h:** Visita a las instalaciones del LMA (2 grupos).
Dr. Guillermo Antorrena (Coordinador Técnico LMA) y D. José Antonio Romero (Promotor Tecnológico en ELECMI).
- 13.00h – 13.45h:** Almuerzo (catering).
- 13.45h – 14.35h:** Microscopía Electrónica de Barrido (SEM): Fundamentos. *Dra. Soraya Sangiao.*
- 14.45h – 15.35h:** SEM. Aplicaciones industriales. *Dr. Teobaldo Torres.*
- 15.45h – 16.15h:** Pausa-café.
- 16.15h – 17.05h:** Espectroscopía Foelectrónica de Rayos X (XPS): Fundamentos. *Dra. Silvia Irusta.*
- 17.15h – 18.05h:** XPS. Aplicaciones industriales. *Dr. Guillermo Antorrena.*

Micro- y Nano-Characterización de Superficies y Materiales

DIRIGIDO A EMPRESAS Y USUARIOS INDUSTRIALES

CURSO
PRÁCTICO
3ª Edición

18, 19 y 20 Abril/2018

Jueves, 19 de Abril

09.00h – 09.50h: Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). Fundamentos y aplicaciones. *Dr. César Magén.*

10.00h – 10.30h: Microscopía TEM de muestras blandas. *Dr. Rodrigo Fernández-Pacheco.*

10.30h – 11.00h: Pausa-café.

11.00h – 11.50h: Microscopía Combinada de Iones y Electrones Focalizados (Dual Beam). Fundamentos y aplicaciones industriales. *Dr. José María De Teresa.*

12.00h – 13.20h: Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). Fundamentos y aplicaciones industriales. *Dr. José Luis Díez.*

13.30h – 14.15h: Almuerzo (catering).

14.15h – 16.05h: Taller-demo técnicas de caracterización.

Grupo 1: XPS. *Dr. Guillermo Antorrena.*

Grupo 2: SEM y Dual-Beam. *Dr. Teobaldo Torres.*

Grupo 3: TEM. *Dres. Alfonso Ibarra y Rodrigo Fernández-Pacheco.*

Grupo 4: AFM. *Dr. José Luis Díez.*

16.15h – 16.45h: Pausa-café.

16.45h – 18.35h: Taller-demo técnicas de caracterización.

Grupo 1: SEM y Dual-Beam. *Dr. Teobaldo Torres.*

Grupo 2: TEM. *Dres. Alfonso Ibarra y Rodrigo Fernández-Pacheco.*

Grupo 3: AFM. *Dr. José Luis Díez.*

Grupo 4: XPS. *Dr. Guillermo Antorrena.*

21.00h: Cena del curso en el centro de la ciudad de Zaragoza para todos los asistentes.

Viernes, 20 de Abril

09.00h – 10.50h: Taller-demo técnicas de caracterización.

Grupo 1: TEM. *Dres. Alfonso Ibarra y Rodrigo Fernández-Pacheco.*

Grupo 2: AFM. *Dr. José Luis Díez.*

Grupo 3: XPS. *Dr. Guillermo Antorrena.*

Grupo 4: SEM y Dual-Beam. *Dña. Laura Casado y Dña. Isabel Rivas.*

11.00h – 11.30h: Pausa-café.

11.30h – 13.20h: Taller-demo técnicas de caracterización.

Grupo 1: AFM. *Dr. José Luis Díez.*

Grupo 2: XPS. *Dr. Guillermo Antorrena.*

Grupo 3: SEM y Dual-Beam. *Dña. Laura Casado y Dña. Isabel Rivas.*

Grupo 4: TEM. *Dres. Alfonso Ibarra y Rodrigo Fernández-Pacheco.*

13.30h – 14.00h: Conclusiones y cierre del curso.
